晶体物相鉴定及定向分析系统，1套，包括：X射线发生器、测角仪、狭缝、探测器、样品台及具备背散射单晶体定向技术。具体要求如下：

1、X射线发生器：

1.1最大输出功率：600 W

1.2最大输出电压：40 kV

1.3最大输出电流：15 mA

1.4光 管：铜靶金属陶瓷X光 管

1.5焦斑：12 x 0.4 mm长细焦斑及点焦斑

2、测角仪:

2.1 扫描方式:立式测角仪， θ/θ 方式，样品水平放置，无倾斜

★2.2 光学定位： DOPS直接光学定位

2.3 测角仪半径： 145 mm

2.3 2θ角度范围： -4° < 2θ < 145°

2.4 扫描速度最快 2.17°/s

★2.5 分辨率：可达：<0.04° 2θ on NIST LaB6

2.6 2θ 线性度： < 0.04° 2θ

★2.7角度重现性： < 0.002°

2.8步进角度：≥ 0.001°

2.9最低起始角度： ≤ 1°

3、狭缝：

3.1固定发散狭缝：狭缝可更换

3.2索拉(Soller)狭缝：标准0.04rad

4探测器：

★4.1PIXcel1D 矩阵探测器

★4.2矩阵通道：≥ 256

4.3像素单元：＞ 65000

4.4 2theta方向通道宽度：≤ 55 微米

4.5 99%线性范围：≥ 6.5\*109cps

4.6 最大计数：≥ 3\*1010 cps

5、样品台：

自旋样品台：样品转速可程序调节

金属样品架：27 毫米内径粉末样品环3枚

★6、外部冷却水:无需外部冷却水

7、具备背散射单晶体定向技术

7.1探测器有效输入面积不小于150mmx100mm；

7.2像元尺寸：>50umx50um

7.3像素：>2700x1800

7.4最大曝光时间：>30分钟

7.5采集模式：14位快速预览和18位高精度模块可选

7.6最大像素合并：≥8x8

7.7三轴定向数据储存格式：.CSV

7.7最大定向精度：≤+/-0.04度

7.8设备自带劳厄图像自动储存和晶体定向软件，可通过千兆网卡连接到电脑。

备注：★标项为重要技术指标，投标货物必须满足★标项。

**售后服务：**

在仪器安装调试验收过程中，需现场免费进行基本培训，培训内容包括仪器结构介绍、操作软件使用、仪器操作使用、日常保养及维护培训等。

24小时电话响应，3个工作日到达现场。